

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12130-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 15.07.2022

Ausstellungsdatum: 15.07.2022

Urkundeninhaber:

**ams-OSRAM international GmbH
Reliability and Failure Analysis Laboratory
Leibnizstraße 4, 93055 Regensburg**

Prüfungen in den Bereichen:

**Messungen an LEDs, Umweltsimulation und Analyse von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen**

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

***Flexibler Bereich (1-4) – Kategorie III
Nicht flexibler Bereich (Seite 5)**

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12130-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfbereich / Einschränkung
Optik	CIE 127:2007	Measurement of LEDs	
Umwelt- simulation	JESD22-A101: 2015	Steady State Temperature Humidity Bias Life Test	
	JESD22-A102: 2015	Accelerated Moisture Resistance – Unbiased Autoclave	
	JESD22-A103: 2015	High Temperature Storage Life	
	JESD22-A104: 2015	Temperature Cycling	
	JESD22-A105: 2011	Power Temperature Cycling	
	JESD22-A106: 2016	Thermal Shock	
	JESD22-A108: 2016	Temperature, Bias and Operating Life	
	JESD22-A113: 2016	Preconditioning of Nonhermetic Surface Mount Devices Prior to Reliability Testing	
	JESD22-A119: 2015	Low Temperature Storage Life	
	JESD22-B106: 2016	Resistance to Soldering Temperature for Through-Hole Mounted Devices	
	ANSI/ESDA/JEDEC JS-001: 2017	Electrostatic Discharge Sensitivity Testing Human Body Model (HBM) - Component Level	
	IEC 60068-2-2: 2007	Environmental testing - Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat	
	DIN EN 60068-2-2: 2008	Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme (IEC 60068-2- 2:2007); Deutsche Fassung EN 60068-2-2:2007	
	IEC 60068-2-14: 2009	Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature	Einschränkung/ Limitation: ohne / without Na, Nb

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12130-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfbereich / Einschränkung
	DIN EN 60068-2-14: 2010	Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperaturwechsel (IEC 60068-2-14:2009); Deutsche Fassung EN 60068-2-14:2009	Einschränkung/ Limitation: ohne / without Na, Nb
	IEC 60068-2-20:2008	Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads	
	DIN EN 60068-2-20: 2009	Umgebungseinflüsse - Teil 2-20: Prüfungen - Prüfung T: Prüfverfahren für die Lötbarkeit und Lötwärmebeständigkeit von Bauelementen mit herausgeführten Anschlüssen	
	IEC 60068-2-58: 2015	Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)	
	DIN EN 60068-2-58: 2016	Umweltprüfungen - Teil 2-58: Prüfungen - Prüfung Td: Prüfverfahren für Lötbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegenüber Auflösen der Metallisierung und Lötwärmebeständigkeit bei oberflächenmontierbaren Bauelementen (SMD) (IEC 60068-2-58:2015); Deutsche Fassung EN 60068-2-58:2015	
	IEC 68-2-67: 1995	Environmental testing Part 2-67: Tests – Test Cy: Damp Heat, Steady State, Accelerated Test Primarily Intended for Components	
	DIN EN 60068-2-67 1996-07	Umweltprüfungen—Teil 2-67: Prüfungen Prüfung Cy: Feuchte Wärme, konstant, beschleunigte Prüfung, vorzugsweise für Bauelemente (IEC 68-2-67:1995) Deutsche Fassung EN 60068-2-67:1996	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12130-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfbereich / Einschränkung
	IEC 60068-2-78: 2014-02	Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-78:2012); Deutsche Fassung EN 60068-2-78:2013	
	IEC 61760-1: 2016	Surface mounting technology – Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMD)	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12130-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfbereich / Einschränkung
Fehleranalyse	A63501-R0108:V3	Elementanalyse mit EDX / Elemental analysis with EDX	
	A63501-R0109:V3	Schliffe eingebetteter Bauteile anfertigen / Cross sectioning of embedded samples	
	A63501-R0110:V3	Messung von geometrischen Größen am REM / Measurement of geometrical dimensions with SEM	
	A63501-R0111:V2	Röntgenanalyse & Bewertung / X-ray analysis & evaluation	
	A63501-R0112:V3	Elektronenmikroskopische Untersuchung / Electron microscopy inspection	
	A63501-R0375:V1	Focussed Ion Beam (FIB) Untersuchung / Focussed Ion Beam (FIB) investigation	

Verwendete Abkürzungen:

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
NDS Hausverfahren der KBS